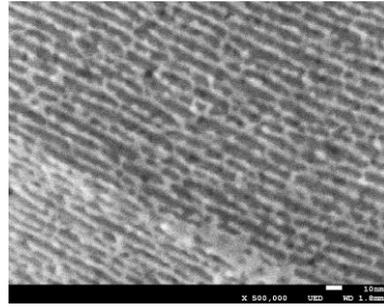


超级混合式物镜

JSM-7800F采用了新开发的电磁场叠加的超级混合式物镜 Super Hybrid Lens (SHL) 和高稳定性的浸没式肖特基场发射电子枪。因此，即使在低加速电压条件下也能够获得高分辨率的图像。

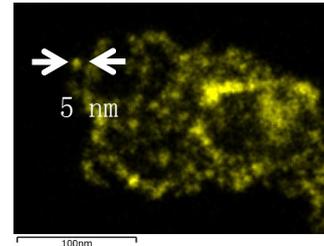
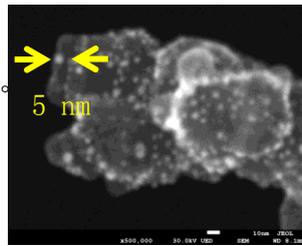


样品：介孔二氧化硅（SBA-15）

由于优化了二次电子检测效率，即使在低加速电压、低探针电流下也能获得绝缘体材料的表面信息。

高空间分辨率的元素分析

JSM-7800F配置了最佳光阑角控制镜，因此，即使在很大的探针电流下也能获得很小的电子束斑。此外，用低加速电压进行元素分析，可以减少电子束在样品中的扩展区域，能进行高空间分辨率的微区分析。



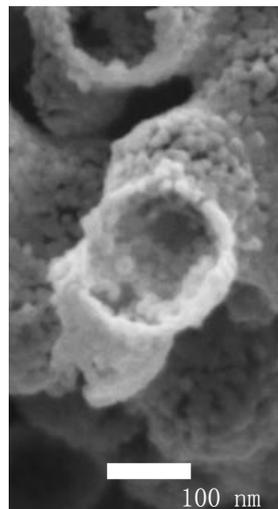
利用7800F的特长之一GBSH，进行了元素面分布，检测出大小约为5 nm的白金颗粒。

同时获取多种信号

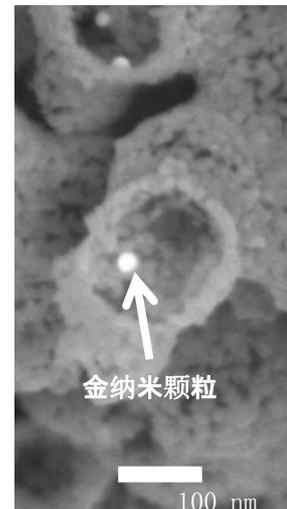
JSM-7800F采用了新开发的检测器系统，因此，即使在1 kV以下的低加速电压下，也能对样品中产生的电子能带进行选择，并且可以同时检测。象右图那样通过调整UED过滤器偏压能够同时获得以二次电子为主的图像和以背散射电子为主的图像。

样品：金颗粒负载的氧化钛

加速电压：2 kV、 UED过滤器偏压：-0.5 kV



获取0~500 eV的电子
以二次电子为主的图像
观察表面形貌和电压衬度



获取500~2000 eV的电子
以背散射电子为主的图像
观察成份和结合状态